

## 各支援業務及び共用設備等における利用料金一覧

業務	分類	共用設備等 (通称、型番等)	利用料金 (円) (消費税及び地方消費税を除く。)	試験単位等 (標準測定時間)
技術相談			無料	
技術代行	顕微鏡装置	原子分解能多機能透過電子顕微鏡 [NEOARM] (JEM-ARM200F)	310,600	1 検体 (4時間以内)
		200kV透過電子顕微鏡[200kV-TEM] (※1) (JEM-2200FS)	230,800	1 検体 (4時間以内)
		走査透過電子顕微鏡[STEM] (HD-2700)	287,700	1 検体 (4時間以内)
		超高分解能電界放出型電子顕微鏡[FE-SEM] (SU9000)	84,300	1 検体 (4時間以内)
		低真空分析走査電子顕微鏡[SEM] (SU6600)	59,500	1 検体 (4時間以内)
		多機能分析走査電子顕微鏡[SEM] (JSM-IT800 (SHL) )	92,300	1 検体 (4時間以内)
		微小デバイス特性評価装置[nanoEBAC] (NE4000)	207,700	1 検体 (4時間以内)
		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置[AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	71,500	1 検体 (4時間以内)
		走査プローブ顕微鏡[SPM] (SPA400)	16,300	1 検体 (2時間以内)
		質量分析計	二重収束型質量分析計[Sector-MS] (※2、※3) (JMS-700 MStation)	19,300
	LC/TOFMS飛行時間型質量分析計[ESI-TOFMS] (※4) (JMS-T100LC AccuTOF)		19,300	1 検体 (1時間以内)
	LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (※4、※5) (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)		19,300	1 検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS] (autoflex II)		19,300	1 検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分 析計[MALDI-Spiral-TOFMS] (JMS-S3000)		19,300	1 検体 (1時間以内)
	DART質量分析計[DART-MS] (JMS-Q1000TD)		19,300	1 検体 (1時間以内)
	X線解析装置		X線構造解析装置 (※6) (SmartLab9kW/IP/HY/N)	30,800
		微小単結晶X線構造解析装置 (VariMax RAPID RA-Micro7)	167,700	1 検体 (20時間以内)
		高性能単結晶X線自動解析装置 (XtaLAB Synergy-R/Cu)	188,500	1 検体 (15時間以内)
	核磁気共鳴装置 及び 電子スピン共鳴装置	600MHz NMR (※7) (JNM-ECA600)	8,000	1 検体 (0.5時間以内)
		500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	6,000	1 検体 (0.5時間以内)
		400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	6,000	1 検体 (0.5時間以内)
		電子スピン共鳴装置[ESR] (JES-FA100N)	14,800	1 検体 (4時間以内)
	表面分析装置	電子線マイクロアナライザ[EPMA] (EPMA1610)	92,300	1 検体 (4時間以内)
		多機能走査型X線光電子分光分析装置[XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	78,900	1 検体 (8時間以内)

	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	23,100	1検体 (4時間以内)
		円二色性分散計[CD] (J-820)	20,800	1検体 (3時間以内)
		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	38,800	1検体 (6時間以内)
		分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	34,200	1検体 (2時間以内)
		光ダイナミクス分光装置(※10) (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	85,000	1検体 (8時間以内)
	元素分析装置	全自動元素分析装置 (2400 II CHNS/O)	4,400	1検体 (0.5時間以内)
		超短波誘導プラズマ元素分析装置 [MIP-MS] (P-6000)	225,800	1検体 (4時間以内)
	物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	27,700	1検体 (4時間以内)
		大気中光電子分光装置 (AC-3)	13,700	1検体 (1時間以内)
		分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	23,100	1検体 (2時間以内)
膜厚測定装置	微細形状測定装置 (ET200)	6,000	1検体 (1時間以内)	
技術補助	技術補助講習(※11)	10,000	1講習 (4時間以内)	
	一般技術補助	10,000	1時間	
機器利用 (※11)	顕微鏡装置	200kV透過電子顕微鏡[200kV-TEM](※1) (JEM-2200FS)	57,700	1時間
		超高分解能電界放出型電子顕微鏡[FE-SEM] (SU9000)	21,100	1時間
		低真空分析走査電子顕微鏡[SEM] (SU6600)	14,900	1時間
		多機能分析走査電子顕微鏡[SEM] (JSM-IT800 (SHL))	23,100	1時間
		微小デバイス特性評価装置[nanoEBAC](※12) (NE4000)	52,000	1時間
		表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置[AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	38,600	1時間
		走査プローブ顕微鏡[SPM] (SPA400)	4,100	1時間
	質量分析装置	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS](※13) (autoflex II)	15,400	1時間
		DART質量分析計[DART-MS] (JMS-Q1000TD)	15,400	1時間
	核磁気共鳴装置	500MHz NMR(※7、※8) (JNM-ECZ500R)	12,000	1時間
		400MHz 固体・溶液NMR(※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	12,000	1時間
	表面分析装置	多機能走査型X線光電子分光分析装置[XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	9,900	1時間
	光学測定装置	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	5,800	1時間
		円二色性分散計[CD] (J-820)	6,900	1時間
		ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	6,500	1時間
		分光エリプソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	17,100	1時間

物性測定装置	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	7,000	1時間
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	13,700	1時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	11,600	1時間
膜厚測定装置	微細形状測定装置 (ET200)	6,000	1時間

・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。

・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料金に加え、別途実費相当額を利用料金として徴収することがある。

- (※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。
- (※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。
- (※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料金を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として1測定当たり別途3検体分の利用料金を徴収する。
- (※4) 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料金を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途500円（消費税及び地方消費税を除く。）を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料金を徴収する。
- (※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料金を徴収する。
- (※6) 1測定当たりの測定時間は最大4時間（装置の立ち上げに係る時間としての1時間を含む。）とし、これを超える場合は、以降3時間ごとに1検体分の利用料金を徴収する。また、オプションユニットを利用して測定した場合は、その測定の種類に応じ、条件調整に係る料金として、1測定当たり別途次の利用料金を徴収する。
  - ①CuK $\alpha$ 1単色化用Ge (220) 2結晶の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
  - ②環境雰囲気ユニットを用いた測定の場合：1,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
  - ③逆格子マップ測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
  - ④インプレーン測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
  - ⑤2D-XRD測定の場合：5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
  - ⑥昇温測定の場合：10,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
- (※7) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。
- (※8) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。
- (※9) 液体サンプルについては技術代行又は機器利用、固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。
- (※10) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体当たりの利用料金とする。
- (※11) 利用者が機器利用をする場合は、あらかじめ機器操作に関する講習として技術補助講習を受講することを基本とする。  
なお、技術補助講習時に利用者の試料を用いて講習を行い、その講習時に得られたデータを利用する場合は、技術代行に係る料金として別途1検体分の利用料金を徴収する。
- (※12) 本学のプローブを利用する場合は、1プローブ当たり別途20,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料金を徴収する。
- (※13) 機器利用において、プレートについては利用者が持込み、サンプル等のプリパレーションについては利用者が用意した後に利用とすることを基本とする。なお、本学のプレートを利用し、サンプル等のプリパレーションを本学で用意する場合は、1測定当たり別途5,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料金を徴収する。